

การทดสอบระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาล็อก

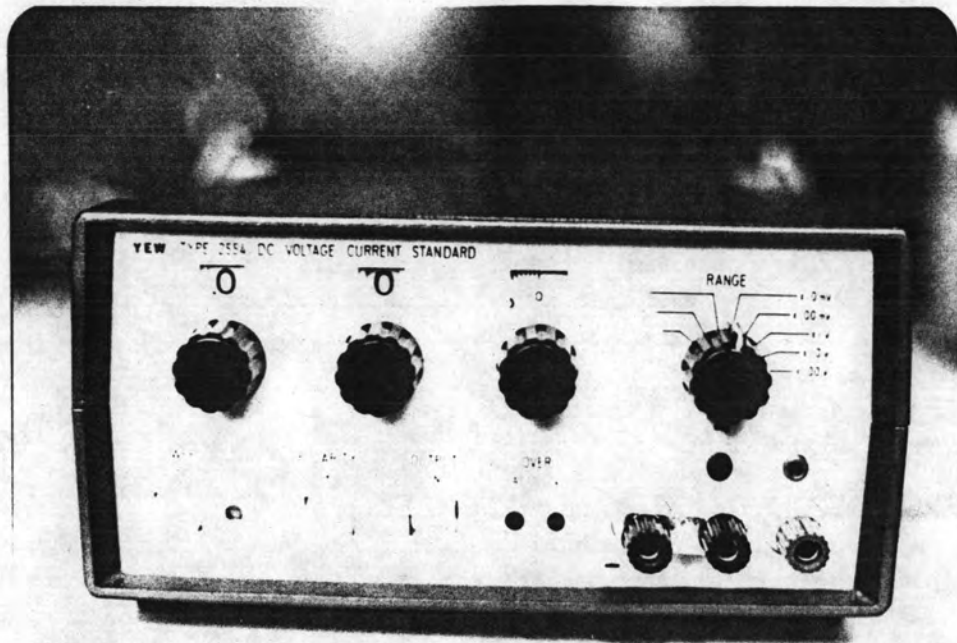
5.1 การทดสอบการวัดค่าข้อมูล

ในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ได้ทำแผงวงจรเลือกสัญญาณไว้ 2 ชนิด คือ แผงวงจรที่ใช้กับเทอร์โมคัปเปิลชนิด CA และแผงวงจรที่ใช้กับกระแสความต้านทานชนิด Pt-100 ซึ่งทรานสดิวเซอร์ทั้งสองชนิดนี้ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิทั้งคู่ การทดสอบจะใช้แหล่งกำเนิดสัญญาณมาตรฐานป้อนเข้าสู่ระบบแทนทรานสดิวเซอร์ เพื่อทดสอบว่าระบบสามารถวัดค่าได้ถูกต้องแม่นยำตามข้อกำหนดหรือไม่ จากนั้นจึงนำระบบไปทดสอบการใช้งานจริง โดยการต่อทรานสดิวเซอร์เข้ากับระบบ และนำไปวัดค่าอุณหภูมิจริงอีกครั้ง

5.1.1 ทดสอบการวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเปิล สามารถแบ่งการปรับแต่งวงจรและทดสอบออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ

ก. ทดสอบการวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า เนื่องจากเทอร์โมคัปเปิลให้สัญญาณออกเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า ดังนั้นแผงวงจรนี้จึงสามารถใช้วัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าทั่วไปที่อยู่ในช่วงเดียวกันได้ อุณหภูมิที่ใช้วัดจะอยู่ในช่วง  $-200^{\circ}\text{C}$  ถึง  $200^{\circ}\text{C}$  จากตารางมาตรฐานของเทอร์โมคัปเปิลในภาคผนวก ก สำหรับเทอร์โมคัปเปิลชนิด CA จะได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าอยู่ในช่วง  $-5.891$  ถึง  $8.137$  mV ดังนั้นจะปรับวงจรขยายให้รับสัญญาณได้ในช่วง  $-10$  ถึง  $10$  mV คือ เมื่อสัญญาณเข้าเป็น  $10$  mV ระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาล็อกจะต้องแสดงค่าเป็น  $20.00$  mV เมื่อโปรแกรมเซ็ทรหัสชนิดของทรานสดิวเซอร์เป็น 2

การทดสอบการวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้านี้ จะใช้เครื่องกำเนิดสัญญาณมาตรฐาน คือ DC VOLTAGE CURRENT STANDARD TYPE 2554 ของบริษัท YOKOGAWA ELECTRIC WORKS, LTD ดังแสดงในรูปที่ 5.1 มีความผิดพลาดไม่เกิน 0.01% การวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้าระบบจะใช้เครื่องวัด คือ DIGITAL MULTIMETER TYPE 8810A ของบริษัท FLUKE ดังแสดงในรูปที่ 5.2 มีความแม่นยำในการวัด 0.01% การทดสอบจะทำโดยการป้อนแรงดันจาก  $-10$  mV จนถึง



รูปที่ 5.1 แสดงเครื่องกำเนิดสัญญาณมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ



รูปที่ 5.2 แสดงเครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบ

10 mV เปลี่ยนค่าครั้งละ 0.5 mV อ่านค่าที่ได้จากเครื่องวัดแรงดัน และจากระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาล็อกทุก ๆ ครั้ง ผลการทดสอบดังแสดงไว้ในภาคผนวก ข สามารถสรุปได้ว่า การวัดแรงดันโดยใช้ระบบเก็บ ข้อมูลแบบอะนาล็อกที่สร้างขึ้นมีความผิดพลาดไม่เกิน 0.05% ซึ่งได้ตามข้อกำหนดในการออกแบบ

ข. ทดสอบการวัดอุณหภูมิโดยใช้แหล่งกำเนิดสัญญาณมาตรฐาน การทดสอบนี้จะต้อง เช็ทหัสชนิดของทรานสดิวเซอร์เป็น 9 ค่าแรงดันที่อ่านได้จากทรานสดิวเซอร์จะถูกผ่านเข้าไปในโปรแกรมการทำให้เป็นเชิงเส้นตรง เปลี่ยนค่าให้แสดงผลเป็นค่าของอุณหภูมิ การสร้างตาราง สำหรับการทำให้เป็นเชิงเส้น จะสร้างจกตารางมาตรฐานของเทอร์โมคัปเปิลในภาคผนวก ก ช่วงห่างของอุณหภูมิแต่ละจุดเท่ากับ 10 °C การคำนวณหาค่า A B C และ D ในโปรแกรมการ ทำให้เป็นเชิงเส้นตรงในหัวข้อ 4.2.11 สามารถคำนวณตามตัวอย่างเช่น ที่อุณหภูมิ 100 °C จะมี แรงเคลื่อนไฟฟ้า 4.095 mV และที่ 90 °C จะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 3.681 mV แต่เนื่องจากได้ ปรับอัตราขยายของวงจรโดยสัญญาณเข้าเป็น 10 mV จะแสดงผลเป็น 20.00 mV ดังนั้นถ้า C = 100 °C จะได้

$$\begin{aligned}
 D &= \frac{4.095 \text{ mV} \times 20 \text{ mV}}{10 \text{ mV}} \\
 &= 8.190 \text{ mV} \\
 A &= \frac{(4.095 \text{ mV} - 3.681 \text{ mV}) \times 20 \text{ mV}}{10 \text{ C} \times 10 \text{ mV}} \\
 &= 0.0828 \text{ mV/ C} \\
 B &= \frac{4.095 \text{ mV} \times 20 \text{ mV}}{10 \text{ mV}} - 0.0828 \text{ mV/ C} \times 100 \text{ C} \\
 &= -0.090 \text{ mV}
 \end{aligned}$$

จากตัวอย่างการคำนวณ สามารถสร้างตารางการทำให้เป็นเชิงเส้นตรงสำหรับการวัดอุณหภูมิในช่วง -200 °C ถึง 200 °C ดังแสดงในตารางที่ 5.1 การทดสอบโดยใช้แหล่งกำเนิดสัญญาณมาตรฐานนี้ ไม่ต้องใช้การชดเชยอุณหภูมิที่จุดอ้างอิงเนื่องจากไม่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดที่จุดอ้างอิง ดังนั้นจะเช็ทค่าอุณหภูมิที่จุดอ้างอิงไว้ที่ 0 °C ทำการทดสอบโดยป้อนแรงดันค่าต่าง ๆ ตามตารางมาตรฐานของเทอร์โมคัปเปิลจากค่า -200 °C ถึง 200 °C อ่านค่าที่ได้จากเครื่องวัด และ

ตารางที่ 5.1 แสดงตารางการทำให้เป็นเชิงเส้นตรงของ  
เทอร์โมคัปเปิลชนิด CA

A mV/°C	B mV	C °C	D mV
0.0322	-5.340	-200	-11.782
0.0360	-4.620	-190	-11.460
0.0392	-4.044	-180	-11.100
0.0416	-3.466	-170	-10.708
0.0458	-2.954	-160	-10.282
0.0486	-2.534	-150	- 9.824
0.0518	-2.086	-140	- 9.338
0.0544	-1,748	-130	- 8.820
0.0572	-1.412	-120	- 8.276
0.0598	-1.126	-110	- 7.704
0.0612	-0.886	-100	- 7.106
0.0644	-0.688	- 90	- 6.484
0.0668	-0.496	- 80	- 5.840
0.0686	-0.370	- 70	- 5.172
0.0708	-0.238	- 60	- 4.486
0.0724	-0.158	- 50	- 3.778
0.0742	-0.086	- 40	- 3.054
0.0758	-0.038	- 30	- 2.312
0.0770	-0.014	- 20	- 1.554
0.0784	-0.000	- 10	- 0.784
0.0794	0.000	10	0.794
0.0802	-0.008	20	1.596
0.0810	-0.024	30	2.406
0.0816	-0.042	40	3.222
0.0812	-0.066	50	4.044
0.0828	-0.096	60	4.872
0.0828	-0.096	70	5.700
0.0832	-0.124	80	6.532
0.0830	-0.108	90	7.362
0.0828	-0.090	100	8.190
0.0826	-0.070	110	9.016
0.0822	-0.026	120	9.838
0.0816	0.046	130	10.654
0.0812	0.098	140	11.466
0.0808	0.154	150	12.274
0.0804	0.214	160	13.078
0.0800	0.278	170	13.878
0.0798	0.312	180	14.676
0.0798	0.312	190	15.474
0.0800	0.274	200	16.274

จากระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาล็อก ผลการทดสอบข้างแสดงไว้ในภาคผนวก ข สามารถสรุปได้ว่าการวัดอุณหภูมิโดยใช้แหล่งกำเนิดสัญญาณมาตรฐานมีความผิดพลาดไม่เกิน 0.1% ของค่าสูงสุด ซึ่งได้ตามข้อกำหนดในการออกแบบ

ค. ทดสอบการวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมคัปเบิลชนิด CA การทดสอบนี้จะต้องใช้โปรแกรมการชดเชยอุณหภูมิที่จุดอ้างอิง การสร้างตารางการชดเชยอุณหภูมิที่จุดอ้างอิง จะหาได้จากการทดลองอย่างหยาบ ๆ เนื่องจากไม่สามารถหาอุปกรณ์ในการสร้างอุณหภูมิรายรอบที่มาตรฐานได้ การทดลองทำโดยการต่อเทอร์โมคัปเบิลชนิด CA เข้าช่องสัญญาณช่องหนึ่ง โปรแกรมที่รหัสชนิดของทรานสดิวเซอร์เป็น 2 นำเทอร์โมคัปเบิลจุ่มลงไปใน้ำแข็งซึ่งถือว่าอุณหภูมิเป็น  $0^{\circ}\text{C}$  อ่านค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาล็อกได้ 2.48 mV และอ่านค่าอุณหภูมิรายรอบขณะนั้น โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ได้  $28^{\circ}\text{C}$  จากนั้นนำระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาล็อกไปอบในกล่องโดยใช้เตาไฟฟ้าจนกระทั่งอุณหภูมิสูงถึง  $40^{\circ}\text{C}$  ให้ปิดเตาไฟฟ้าทิ้งไว้สักครู่เพื่อให้อุณหภูมิกายในกล่องกระจายสม่ำเสมอ อ่านค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาล็อกได้ 3.46 mV และอ่านค่าอุณหภูมิบริเวณจุดอ้างอิงได้  $39^{\circ}\text{C}$  จากข้อมูลที่ได้จะถือความสัมพันธ์เชิงเส้นของแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จุดอ้างอิงกับอุณหภูมิ จะเป็นเส้นตรงจาก  $0^{\circ}\text{C}$  ถึง  $28^{\circ}\text{C}$  และจาก  $28^{\circ}\text{C}$  ถึง  $39^{\circ}\text{C}$  การสร้างตารางชดเชยอุณหภูมิที่จุดอ้างอิง สามารถหาค่า A B C และ D ได้โดยให้  $C = 39^{\circ}\text{C}$  จะได้

$$D = 3.46 \text{ mV}$$

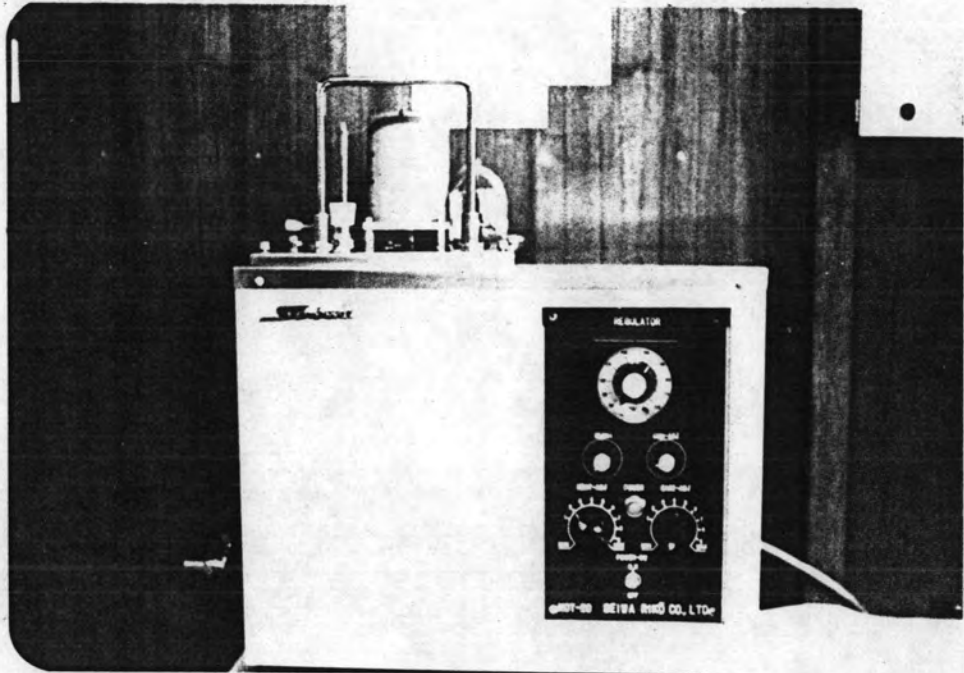
$$A = \frac{3.46\text{mV} - 2.48 \text{ mV}}{39^{\circ}\text{C} - 28^{\circ}\text{C}}$$

$$= 0.0891 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$$

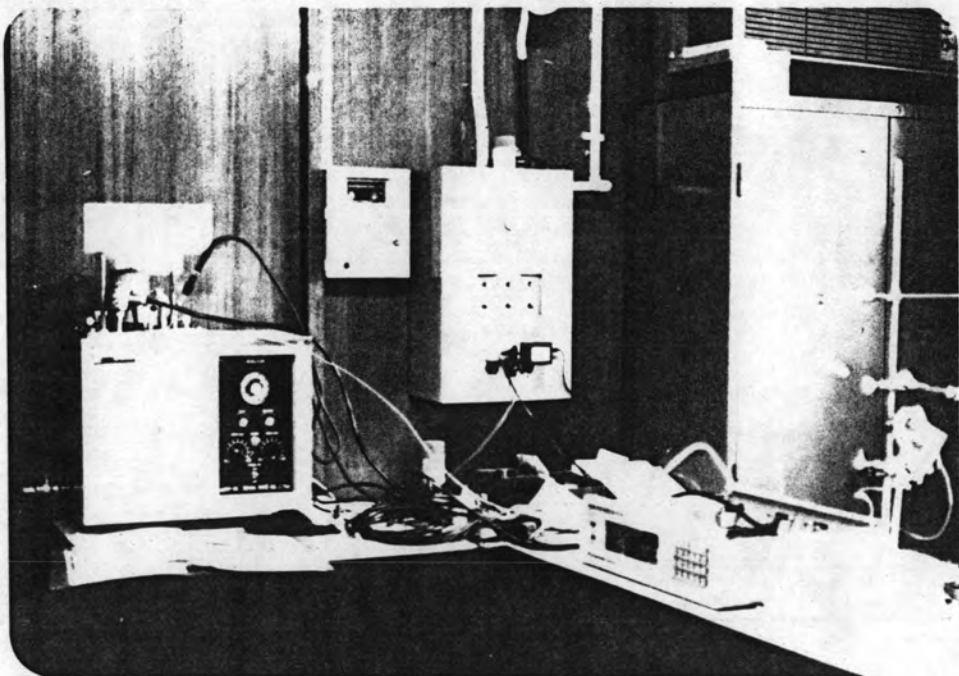
$$B = 3.46 \text{ mV} - 0.0891 \text{ mV}/^{\circ}\text{C} \times 39^{\circ}\text{C}$$

$$= -0.0149 \text{ mV}$$

จากการทดลองและคำนวณ สามารถสร้างตารางการชดเชยอุณหภูมิที่จุดอ้างอิงข้างแสดงในตารางที่ 5.2 การทดสอบการวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมคัปเบิลชนิด CA จะต้องใช้ OIL BATH สำหรับอุ่นน้ำมันให้ร้อน โดยใช้ OIL BATH TYPE NOT-20 ของบริษัท SEIWA RIKO CO,LTD ดังแสดงในรูปที่ 5.3 เป็นเครื่องทดสอบ สามารถอุ่นน้ำมันได้ตั้งแต่  $50^{\circ}\text{C}$  ถึง  $250^{\circ}\text{C}$  การทดสอบจะต้องต่อเทอร์โมคัปเบิลเข้าที่ช่องสัญญาณหนึ่งและต่อกระเปาะความดันทานเข้าที่ช่องสัญญาณ



รูปที่ 5.3 แสดง OIL BATH TYPE NOT-20

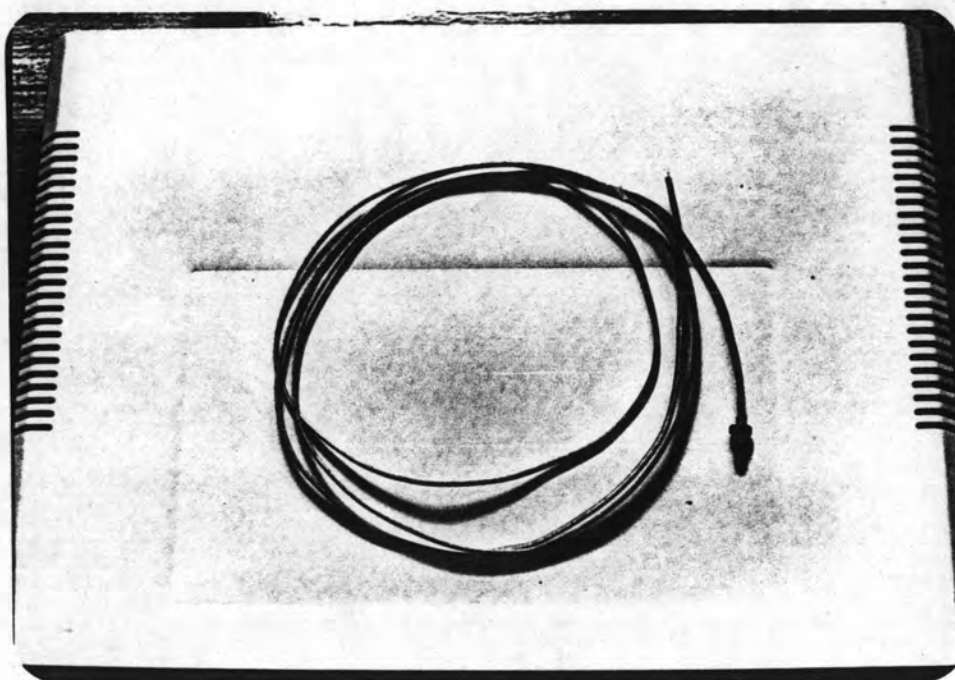


รูปที่ 5.4 แสดงการทดสอบการวัดอุณหภูมิจริงด้วยเทอร์โมคัปเปิล  
และกระเปาะความดัน

ตารางที่ 5.2 แสดงตารางการชดเชยอุณหภูมิที่จุดอ้างอิง  
ของเทอร์โมคัปเปิลชนิด CA

A mV/°C	B mV	C °C	D mV
0.0886	0.0000	28.0	2.48
0.0891	-0.0149	39.0	3.46

อุณหภูมิที่จุดอ้างอิง นำเทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะแก้ว มีความละเอียด 0.1°C มาวัดที่ OIL BATH และที่จุดอ้างอิง ดังแสดงในรูปที่ 5.4 จากนั้นเริ่มตั้ง OIL BATH อุณหภูมิที่ 60°C เมื่ออุณหภูมิน้ำมันหยุดนิ่งแล้ว ให้อ่านค่าอุณหภูมิที่ OIL BATH อ่านค่าอุณหภูมิที่จุดอ้างอิง และอ่านค่าอุณหภูมิจากระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาล็อก เมื่อบันทึกผลเรียบร้อยแล้ว ให้เพิ่มอุณหภูมิของ OIL BATH เป็น 80°C และทำการวัดค่าเช่นเดียวกัน จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิครั้งละ 20°C จนถึง 180°C ผลการทดสอบดังแสดงไว้ในภาคผนวก ข ซึ่งจะเห็นว่าผลที่ได้มีความผิดพลาดเกินกว่า 0.1% ของ

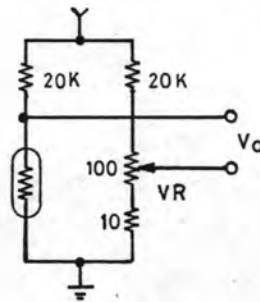


รูปที่ 5.5 แสดงเทอร์โมคัปเปิลที่ใช้ในการทดสอบ

ค่าสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากเทอร์โมคัปเปิลที่ใช้เป็นของบริษัท OMRON รุ่น E52-CA1D ดังแสดงในรูปที่ 5.5 มีความผิดพลาดได้ถึง 0.75% และไม่สามารถหาเทอร์โมคัปเปิลที่มีความผิดพลาดไม่เกิน 0.1% ในท้องตลาดได้ นอกจากนี้อาจเกิดจากความผิดพลาดในการชดเชยอุณหภูมิที่จุดอ้างอิงเนื่องจากทดลองหาค่าอย่างหยาบ ๆ หรือความผิดพลาดจากการอ่านค่าเทอร์โมมิเตอร์อีกแห่งหนึ่ง

5.1.2 ทดสอบการวัดอุณหภูมิด้วยกระแสความต้านทาน สามารถแบ่งการปรับแต่งวงจรและทดสอบเป็น 3 ขั้นตอน คือ

ก. ทดสอบการวัดแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากวงจรบริดจ์ไม่สมดุล เนื่องจากกระแสความต้านทานให้ค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ดังนั้นจึงต้องต่อวงจรสัญญาณเข้าเป็นวงจรบริดจ์โดยมีค่าต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 5.6 ก่อนอื่นจะต้องปรับวงจรบริดจ์ให้สมดุลก่อนโดยใช้ตัวความต้านทานมาตรฐานปรับค่าได้ DECADE RESISTANCE BOX TYPE 2793 ของบริษัท YOKOGAWA ELECTRIC WORKS, LTD ดังแสดงในรูปที่ 5.7 ต่อเข้ากับวงจรบริดจ์และตั้งค่าไว้ที่ 100 โอห์ม และใช้เครื่องวัด คือ DIGITAL MULTIMETER TYPE 8840 A วัดค่าแรงดันไฟฟ้าของวงจรบริดจ์ ปรับค่า VR จนกระทั่งบริดจ์สมดุล แรงดันที่วัดได้เป็นศูนย์



รูปที่ 5.6 แสดงวงจรบริดจ์ที่ใช้กับกระแสความต้านทาน

การวัดอุณหภูมิโดยใช้กระแสความต้านทานนี้ จะใช้อยู่ในช่วง  $-200^{\circ}\text{C}$  ถึง  $200^{\circ}\text{C}$  จากตารางมาตรฐานของกระแสความต้านทานในภาคผนวก ก สำหรับกระแสความต้านทานชนิด Pt-100 จะให้ความต้านทานอยู่ในช่วง 17.14 โอห์ม ถึง 177.13 โอห์ม การปรับอัตราขยายของวงจรขยาย ทำได้โดยการตั้งตัวความต้านทานมาตรฐานปรับค่าได้ไว้ที่ 177.13 โอห์ม และตั้งรหัสชนิดของทรานซิสเตอร์เป็น 2 ปรับอัตราขยายของวงจรขยายสัญญาณจนกระทั่งระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาล็อกอ่านค่าได้ 20.00 mV





รูปที่ 5.7 แสดงตัวความต้านทานมาตรฐานปรับค่าได้ที่ใช้ในการทดสอบ

การทดสอบในขั้นตอนนี้ จะทดสอบการวัดแรงดัน เมื่อเปลี่ยนค่าความต้านทานไปตามตารางมาตรฐานโดยจะคำนวณจากวงจรดังแสดงไว้ในรูปที่ 5.6 โดยหาค่าคงที่  $K$  ดังนี้ คือ

$$20 \text{ mV} = \left( \frac{177.13}{20K + 177.13} - \frac{100}{20K + 100} \right) K$$

$$K = 5258.14$$

จากนั้นคำนวณหาค่าแรงดันที่เกิดขึ้นที่ค่าความต้านทานต่าง ๆ ดังแสดงตัวอย่าง เช่น ที่  $100^\circ\text{C}$  ความต้านทานของกระเปาะความต้านทานเท่ากับ  $139.16$  โอห์ม จะได้แรงดันที่เกิดจากความไม่สมดุลย์ของวงจรบริดจ์ คือ

$$\begin{aligned} V &= \left( \frac{139.16}{20K + 139.16} - \frac{100}{20K + 100} \right) \times 5258.14 \\ &= 10.1734 \text{ mV} \end{aligned}$$

ที่  $90^\circ\text{C}$  ความต้านทานของกระเปาะความต้านทานเท่ากับ  $135.30$  โอห์ม จะได้แรงดันที่เกิดจากความไม่สมดุลย์ของวงจรบริดจ์ คือ

$$V = \left( \frac{135.30}{20K + 135.30} - \frac{100}{20K + 100} \right) \times 5258.14 \text{ mV}$$

$$= 9.1724 \text{ mV}$$

เมื่อกำหนดค่าแรงดันได้ครบแล้ว ทำการทดสอบโดยการปรับค่าตัวความต้านทานมาตรฐาน ตามตารางมาตรฐาน อ่านค่าแรงดันไฟฟ้าจากระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาล็อก ผลการทดสอบ ดังแสดงไว้ในภาคผนวก ข สามารถสรุปได้ว่า ระบบสามารถวัดแรงดันจากวงจรบริดจ์ มีความผิดพลาดไม่เกิน 0.1% ของค่าสูงสุด ซึ่งได้ตามข้อกำหนดในการออกแบบ

ข. ทดสอบการวัดอุณหภูมิโดยใช้ตัวความต้านทานมาตรฐาน การทดสอบนี้จะต้อง โปรแกรมเซพเทรทส์ของทรานสดิวเซอร์เป็น 12 ค่าแรงดันที่อ่านได้จากวงจรบริดจ์จะถูกผ่านเข้าไป ในโปรแกรมการทำให้เป็นเชิงเส้นตรง เปลี่ยนค่าให้แสดงผลเป็นค่าอุณหภูมิ การสร้างตาราง มาตรฐาน จะต้องสร้างจากค่าที่คำนวณได้ในข้อ ก. โดยช่วงของอุณหภูมิแต่ละจุดเท่ากับ  $10^{\circ}\text{C}$  กำหนดค่า A B C และ D ของโปรแกรมการทำให้เป็นเชิงเส้นตรงดังตัวอย่างเช่น

$$\begin{aligned} \text{จากข้อ ก. ที่ } 100^{\circ}\text{C} \text{ จำนวนแรงดันได้ } & 10.173 \text{ mV} \\ \text{ที่ } 90^{\circ}\text{C} \text{ จำนวนแรงดันได้ } & 9.172 \text{ mV} \\ \text{ถ้า } C = 100^{\circ}\text{C} \quad D = & 10.173 \text{ mV} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &= \frac{10.1734 \text{ mV} - 9.1724 \text{ mV}}{10^{\circ}\text{C}} \\ &= 0.10010 \text{ mV}/^{\circ}\text{C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 10.1734 \text{ mV} - 0.10010 \text{ mV}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C} \\ &= 0.1634 \text{ mV} \end{aligned}$$

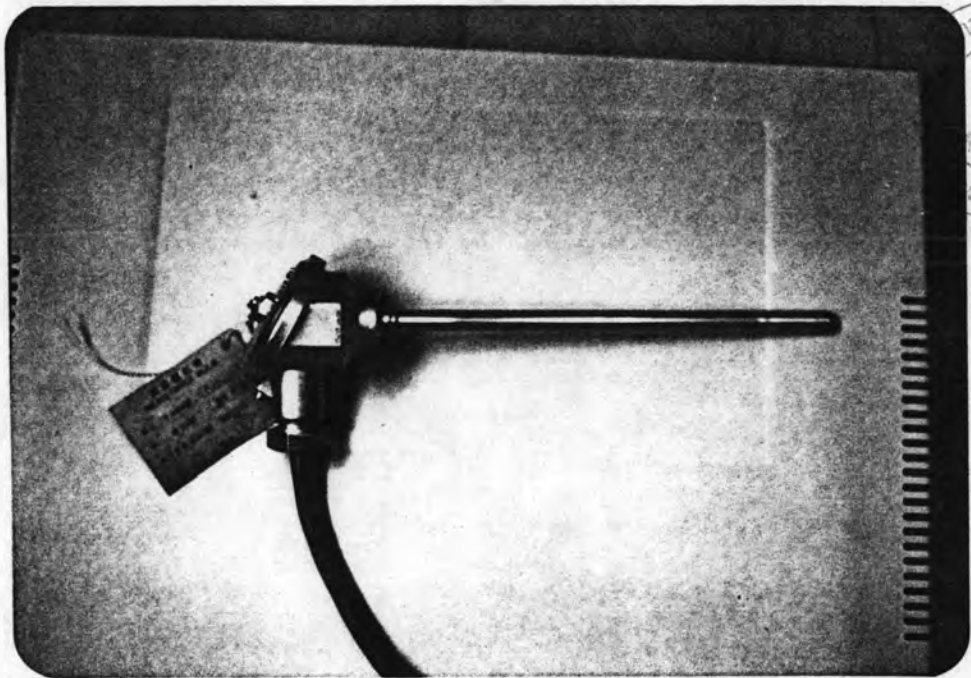
จากตัวอย่างการคำนวณ สามารถสร้างตารางการทำให้เป็นเชิงเส้นตรงของกระเปาะ ความต้านทานชนิด Pt-100 สำหรับวัดอุณหภูมิในช่วง  $-200^{\circ}\text{C}$  ถึง  $200^{\circ}\text{C}$  ดังแสดงในตารางที่ 5.3 การทดสอบจะทำโดยการปรับค่าความต้านทานมาตรฐาน ตามค่าในตารางมาตรฐานของ กระเปาะความต้านทาน จากค่า  $-200^{\circ}\text{C}$  ถึง  $200^{\circ}\text{C}$  และอ่านค่าอุณหภูมิจากระบบเก็บข้อมูลแบบ อะนาล็อก ผลการทดสอบดังแสดงไว้ในภาคผนวก ข สามารถสรุปได้ว่า การวัดอุณหภูมิโดยใช้ตัว ความต้านทานมาตรฐานปรับค่าได้ มีความผิดพลาดไม่เกิน 0.1% ของค่าสูงสุด ซึ่งได้ตามข้อ กำหนดในการออกแบบ

ตารางที่ 5.3 แสดงตารางการทำให้เป็นเชิงเส้นตรงของ

กระเปาะความต้านทานชนิด Pt-100

R ohm	A mV/°C	B mV	C °C	D mV
17.14	0.11335	-1.0125	-200	-21.6575
21.46	0.11384	-1.1056	-190	-20.5240
25.80	0.11326	-1.0012	-180	-19.3856
30.12	0.11268	-0.9026	-170	-18.2530
34.42	0.11159	-0.7282	-160	-17.1262
38.68	0.11076	-0.6037	-150	-16.0103
42.91	0.10992	-0.4861	-140	-14.9027
47.11	0.10936	-0.4133	-130	-13.8035
51.29	0.10853	-0.3137	-120	-12.7099
55.44	0.10796	-0.2510	-110	-11.6246
59.57	0.10739	-0.1940	-100	-10.5450
63.68	0.10682	-0.1427	-90	-9.4711
67.77	0.10652	-0.1187	-80	-8.4029
71.85	0.10596	-0.0795	-70	-7.3377
75.91	0.10565	-0.0609	-60	-6.2781
79.96	0.10509	-0.0329	-50	-5.2216
83.99	0.10479	-0.0209	-40	-4.1707
88.01	0.10448	-0.0116	-30	-3.1228
92.02	0.10418	-0.0056	-20	-2.0780
96.02	0.10362	-0.0000	-10	-1.0362
103.97	0.10332	0.0000	10	1.0332
107.93	0.10301	0.0031	20	2.0633
111.88	0.10272	0.0089	30	3.0905
115.81	0.10216	0.0257	40	4.1121
119.73	0.10185	0.0381	50	5.1306
123.64	0.10156	0.0529	60	6.1462
127.54	0.10126	0.0706	70	7.1588
131.42	0.10070	0.1098	80	8.1658
135.30	0.10066	0.1130	90	9.1724
139.16	0.10010	0.1634	100	10.1734
143.01	0.09981	0.1924	110	11.1715
146.85	0.09951	0.2254	120	12.1666
150.67	0.09895	0.2926	130	13.1561
154.49	0.09892	0.2965	140	14.1453
158.29	0.09836	0.3749	150	15.1289
162.08	0.09806	0.4199	160	16.1095
165.86	0.09777	0.4663	170	17.0872
169.63	0.09747	0.5173	180	18.0619
173.38	0.09693	0.6145	190	19.0312
177.13	0.09688	0.6240	200	20.0000

ค. ทดสอบการวัดอุณหภูมิโดยใช้กระเปาะความต้านทานชนิด Pt-100 การทดสอบทำได้โดยต่อกระเปาะความต้านทานเข้ากับช่องสัญญาณหนึ่ง นำไปวัดอุณหภูมิใน OIL BATH ชั้นตอนการทดสอบโดยใช้ OIL BATH ทำเช่นเดียวกับการทดสอบการวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเปิลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ผลการทดสอบได้แสดงไว้ในภาคผนวก ข ซึ่งจะเห็นว่าค่าที่ได้มีความผิดพลาดเกินกว่า 0.1% ทั้งนี้เนื่องจากกระเปาะความต้านทานที่ใช้เป็นของบริษัท CHINO รุ่น MCN-11D ดังแสดงในรูปที่ 5.8 มีความผิดพลาดได้ถึง 0.15% นอกจากนี้อาจเกิดจากการอ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์อีกแห่งหนึ่ง



รูปที่ 5.8 แสดงกระเปาะความต้านทานชนิด Pt-100 ที่ใช้ในการทดสอบ

## 5.2 การทดสอบความเร็วในการสแกนหัววัด

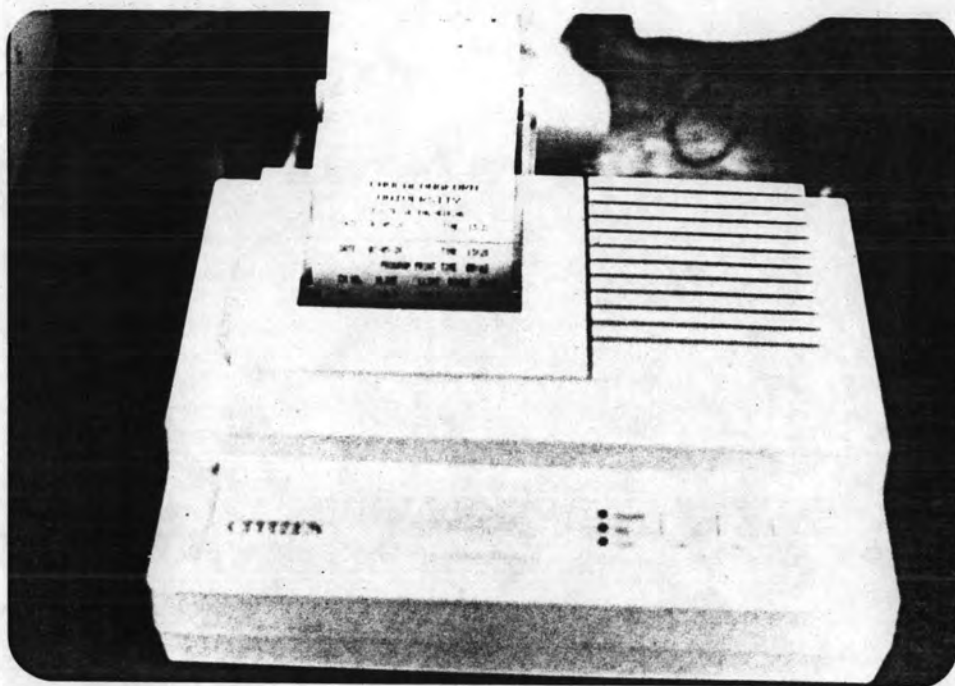
การทดสอบความเร็วในการสแกนหัววัด โดยทั่วไปจะทำการทดสอบโดยการป้อนสัญญาณเข้าช่องสัญญาณต่าง ๆ ด้วยค่าสูงสุดของการวัดทุกช่องสัญญาณ จากนั้นจับเวลาการสแกนหัววัดจนครบรอบทุกช่องสัญญาณ ก็สามารถหาความเร็วในการสแกนหัววัดได้ แต่เนื่องจากการสร้างเครื่องต้นแบบได้สร้างแผงวงจรเลือกสัญญาณเพียง 2 แผงเท่านั้น การทดสอบวิธีนี้จึงไม่สามารถนำมาใช้

ได้ ดังนั้นการตรวจสอบเกี่ยวกับความเร็วในการเร็วในการสแกนหัววัด จะต้องใช้วิธีการตรวจหาเวลาของการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ และเวลาที่ใช้ในการทำโปรแกรม

จากการทดสอบในการสร้างและประกอบวงจรแล้ว จะได้ว่าการแปลงสัญญาณของหัววัดแต่ละตัวจะต้องใช้เวลา 0.080 วินาที และจะต้องเสียเวลาให้กับรีตริเลย์ในการทำงานอีก .01 วินาที ดังนั้นจะต้องทดสอบหาเวลาที่เสียไปมากที่สุดในการทำโปรแกรม จากโปรแกรมการทำงานของระบบในหัวข้อ 4.1.5 หลังจากจบโปรแกรมน้อย ๆ แต่ละโปรแกรมจะมีการตรวจสอบสภาวะการอินเทอร์รัพท์จากภาคแปลงสัญญาณทุกครั้ง ดังนั้นเวลาที่เสียไปมากที่สุดจะเท่ากับโปรแกรมน้อยที่ยาวที่สุด ดังนั้นจะต้องตรวจหาเวลาของโปรแกรมน้อยต่าง ๆ การตรวจสอบอาจทำได้จากการคำนวณ ซึ่งค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากโปรแกรมแต่ละโปรแกรมจะมีความยาวมาก ดังนั้นจะตรวจสอบโดยการวัดช่วงเวลาแต่ละโปรแกรม จากวงจรในภาคเลือกสัญญาณจะเห็นว่า พอร์ทของ PIA 8255 จะยังมีเหลืออีกมาก ดังนั้นเราจะใช้พอร์ทเหล่านี้ในการทดสอบ โดยการเซทพอร์ทไว้ที่ "1" เมื่อเริ่มโปรแกรมน้อย และเมื่อจบโปรแกรมน้อยก็จะเซทกลับเป็น "0" เมื่อเปิดเครื่องทำงาน และใช้ออสซิลโลสโคปจับคูที่พอร์ทนั้น และดูช่วงเวลาสัญญาณเป็น "1" ยาวที่สุดเท่าไร ก็จะได้เวลาที่สูงสุดในการทำโปรแกรมน้อยนั้น ผลการตรวจสอบในโปรแกรมที่สร้างขึ้น ได้โปรแกรมน้อยยาวที่สุด จะใช้เวลาสูงสุดเพียง 0.0012 วินาที เท่านั้น ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า เวลาที่ใช้ในการสแกนหัววัดหนึ่งหัววัดนั้น จะใช้เวลาสูงสุด 0.0912 วินาที ซึ่งได้ตามข้อกำหนดที่ออกแบบไว้

### 5.3 การทดสอบการพิมพ์รายงาน

ระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาลอกที่สร้างขึ้น สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ทุกชนิดที่ใช้สแตนด์-ทรอนิกส์ เช่น เครื่องพิมพ์ที่ใช้ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป แต่รูปแบบการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่รหัสควบคุมของแต่ละเครื่อง ในการออกแบบโปรแกรมควบคุมระบบนี้ได้ออกแบบใช้งานสำหรับเครื่องพิมพ์ CITIZEN TYPE iDP-560 ของบริษัท JAPAN CBM CORPORATION



รูปที่ 5.9 แสดงเครื่องพิมพ์ที่ใช้กับระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาลอก

ดังแสดงในรูปที่ 5.9 ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ชนิด 7x5 DOT MATRIX พิมพ์ได้ 40 ตัวอักษรต่อบรรทัด สามารถพิมพ์อักษรตัวใหญ่ขนาด 20 ตัวอักษรต่อบรรทัด นอกจากนี้ยังสามารถสั่งให้พิมพ์อักษรเป็นสีแดงได้

การทดสอบการพิมพ์รายงาน จะเริ่มตั้งแต่เปิดเครื่อง เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หัวกระดาษ วัน เดือน ปี และเวลา ตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จสิ้นให้โปรแกรมตั้งช่วงเวลาการพิมพ์ไว้ 3 นาที และโปรแกรมค่าต่าง ๆ ให้กับระบบ จากนั้นกดปุ่ม PRINT ระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาลอกจะสั่งเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์ค่าต่าง ๆ ที่โปรแกรมไว้ทั้งหมด ดังนั้นเราจะได้รับรายงานค่าที่ตั้งให้กับระบบไม่ต้องไปเลือกดูจากภาคแสดงผล เมื่อการพิมพ์เสร็จสิ้นลงให้กดปุ่ม PROG เปลี่ยนโหมดการทำงานมาเป็น HOLD MODE เครื่องจะพิมพ์โมคใหม่พร้อมทั้งเวลาขณะที่กดปุ่มเพื่อเป็นรายงานให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนโหมดการทำงานของระบบเวลาใด ในโมคนี้ถ้ากดปุ่ม PRINT เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ข้อมูลที่อ่านได้จากทรานสดิวเซอร์ทุกช่องสัญญาณที่โปรแกรมเซ็ทค่าไว้ พร้อมทั้งช่องสัญญาณที่มีข้อมูลผิดปกติ

CHULALONGKORN  
UNIVERSITY

ELECTRICAL ENGINEERING

DATE 03-05-28 TIME 13:48

DATE 03-05-28 TIME 13:50

PROGRAM PRINT TIME 00:03

CH NO.	HLIMIT	LLIMIT	RANGE	UNIT
001	199.9	-199.9	9	C
002	199.9	50.0	9	C
003	199.9	199.9	9	C
004	199.9	199.9	9	C
005	.0	-199.9	9	C
006	199.9	199.9	9	C
007	199.9	199.9	9	C
008	199.9	199.9	9	C
009	199.9	199.9	9	C
010	199.9	199.9	9	C
011	199.9	199.9	9	C

222	0	0	0	mV
223	0	0	0	mV
224	0	0	0	mV
225	0	0	0	mV
226	0	0	0	mV
227	1999	1999	0	mV
228	0	0	0	mV
229	1999	- 1999	0	mV
230	0	0	0	mV
231	0	0	0	mV
232	0	0	0	mV
233	0	0	0	mV
234	0	0	0	mV
235	0	0	0	mV
236	0	0	0	mV
237	0	0	0	mV
238	0	0	0	mV
239	0	0	0	mV
240	1999	- 1999	0	mV

HOLD TIME 13:52

DATE 03-05-28 TIME 13:53

CH NO.	DATA	UNIT	CH NO.	DATA	UNIT
001	28.3	C	002	36.5	C
005	36.1	C	015	36.3	C

\* UNDER LOW LIMIT

002 36.5 C

\* OVER HIGH LIMIT

005 36.1 C

\* OVER RANGE

NOT FOUND

RUN TIME 13:53

DATE 03-05-28 TIME 13:56

CH NO.	DATA	UNIT	CH NO.	DATA	UNIT
001	28.4	C	002	36.2	C
005	36.2	C	015	36.2	C

\* UNDER LOW LIMIT

002 36.2 C

\* OVER HIGH LIMIT

005 36.2 C

\* OVER RANGE

NOT FOUND

DATE 03-05-28 TIME 13:59

CH NO.	DATA	UNIT	CH NO.	DATA	UNIT
001	28.4	C	002	36.2	C
005	36.6	C	015	36.3	C

\* UNDER LOW LIMIT

002 36.2 C

\* OVER HIGH LIMIT

005 36.6 C

\* OVER RANGE

NOT FOUND

รูปที่ 5.10 แสดงการพิมพ์รายงานของระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาล็อก

ขณะที่อยู่ใน HOLD MODE ให้กดปุ่ม HOLD เพื่อเปลี่ยนไปยัง RUN MODE เครื่องพิมพ์จะพิมพ์โมคใหม่พร้อมทั้งเวลาเช่นกัน หลังจากที่เปลี่ยนมาที่โมคนี้ได้ 3 นาที ระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาลอกจะสั่งเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์รายงานเช่นเดียวกับที่พิมพ์ใน HOLD MODE และเมื่อครบเวลารอบต่อไปก็จะมีการพิมพ์รายงานอีกเช่นกัน โดยจะมีการพิมพ์รายงานออกทุก ๆ 3 นาที ผลการพิมพ์ตามขั้นตอนดังกล่าวมาแล้วจะแสดงไว้ในรูปที่ 5.10

#### 5.4 การทดสอบการรับส่งข้อมูลกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

การทดสอบการรับส่งข้อมูลกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จะต้องเขียนโปรแกรมให้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการติดต่อกับระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาลอก โดยจะเขียนเป็นโปรแกรมภาษาเบสิกสำหรับเรียกอ่านข้อมูลจากระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาลอก แต่โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมการรับส่งข้อมูลจะเขียนเป็นภาษาเครื่อง และจะถูกเรียกใช้ในภาษาเบสิก โปรแกรมที่เป็นภาษาเครื่องจะเขียนเป็นภาษาแอสเซมบลีของ CPU 6502 และใช้โปรแกรม SC-MACRO ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม โปรแกรมต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นดังแสดงไว้ในภาคผนวก ง

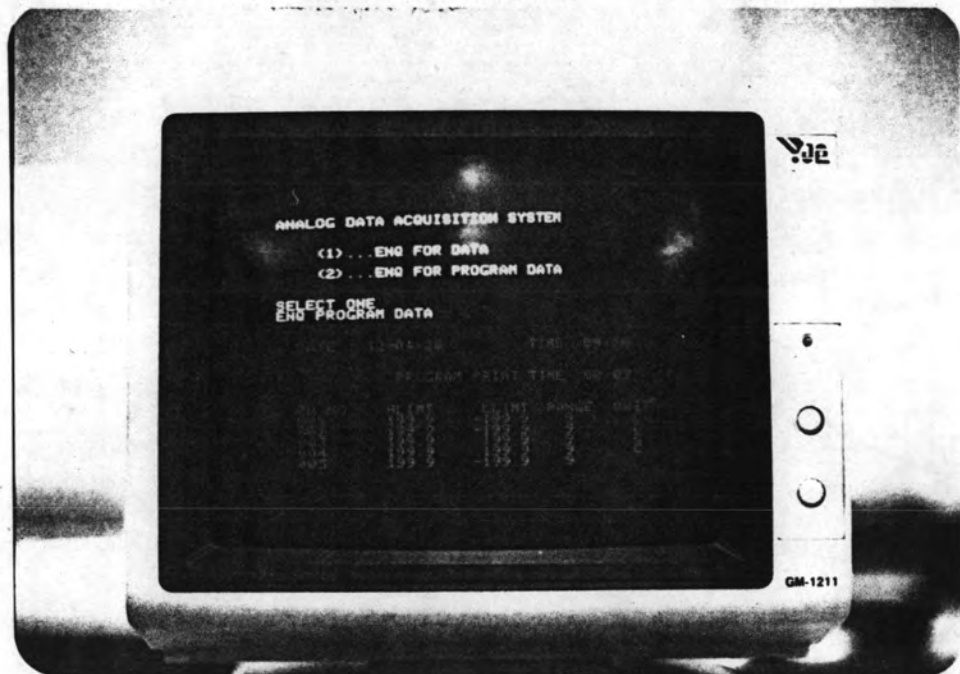


รูปที่ 5.11 แสดงการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  
กับระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาลอก





รูปที่ 5.12 แสดงข้อมูลเมื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ต้องการ  
ข้อมูลที่อ่านจากทรานสดิวเซอร์



รูปที่ 5.13 แสดงข้อมูลเมื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ต้องการ  
ข้อมูลที่เซทจากแป้นกดข้อมูล

ในการทดสอบจะใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ MEDFLY ต่อเข้ากับระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาลอกทางคอนเนคเตอร์ SERIAL OUT ดังแสดงในรูปที่ 5.11 จากนั้นทำโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา RUN ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จะมีการแสดงผลบนจอ CRT ให้เลือกหัวข้อว่าต้องการข้อมูลที่อ่านจากทรานสดิวเซอร์ (ENQ FOR DATA) หรือข้อมูลที่เซ็ทจากแป้นกดข้อมูล (ENQ FOR PROGRAM DATA)

ถ้าต้องการข้อมูลที่อ่านจากทรานสดิวเซอร์ จะต้องกดปุ่ม "1" เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จะทำการรับข้อมูลจากระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาลอกสักครู่หนึ่ง จากนั้นจึงแสดงผลข้อมูลบนจอ CRT ดังแสดงในรูปที่ 5.12 แต่ถ้าต้องการข้อมูลที่เซ็ทจากแป้นกดข้อมูล จะต้องกดปุ่ม "2" จะได้ผลดังแสดงในรูปที่ 5.13 จะเห็นว่าระบบเก็บข้อมูลสามารถส่งข้อมูลมาแสดงผลบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ได้ตามที่ออกแบบไว้ โดยมีรูปแบบเช่นเดียวกับการส่งข้อมูลไปพิมพ์รายงาน